

DIN 50451-4:2007-02 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 4: Bestimmung von 34 Elementen in hochreinem Wasser durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	4
4 Einheiten	4
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens.....	4
6 Reagenzien.....	4
7 Geräte und Reinigung.....	5
8 Probenahme	5
9 Vorbehandlung der Proben	6
10 Durchführung.....	6
11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse.....	7
12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse.....	7
13 Prüfbericht	8
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche	9
Literaturhinweise.....	13

Tabellen

Tabelle A.1 — Präzision und Richtigkeit der an einer mit 20 ng/kg dotierten Wasserprobe nach Probenanreicherung ermittelten Daten	9
Tabelle A.2 — Präzision und Richtigkeit der an einer mit 20 ng/kg dotierten Wasserprobe ermittelten Daten bei Direktmessung ohne Probenanreicherung	11